

## 산화층에 있어 온도변화에 의한 전기전도도에 관한연구

안 영 필 · 이 희 동  
한양대학교 무기재료공학과  
(1982년 12월 29일 접수)

### The Dependence of Electrical Conductivity of Cupric Oxide on Temperature

Young-Pil Ahn and Hee-Dong Lee

Dept. of Inorganic Material Eng., Hanyang Univ.

(Received Dec. 29, 1982)

#### ABSTRACT

We studied the dependence of electrical conduction mechanism of Cupric Oxide on temperature and measured the specific resistivity of sintered specimen from 600°C to 900°C. We considered the relations between electrical conductivity and temperature with reheating the sintered specimen. X-Ray diffraction patterns showed that lattice parameters of cupric oxide increased above 200°C. Cupric oxide had nonstoichiometric compositions ( $\text{CuO}_{1+\delta}$ ) owing to the excess oxygen and showed hole conduction with energy gap of 0.15 eV below  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ . Above  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ , cupric oxide had the stoichiometric composition and showed electron-hole conduction owing to the intrinsic ionization with energy gap of 1.04 eV.

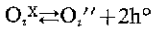
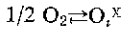
#### 1. 서 론

산화층에는 산화제 I 동( $\text{Cu}_2\text{O}$ )과 산화제 II 동( $\text{CuO}$ )의 두 종류가 있는데 산화제 I 동( $\text{Cu}_2\text{O}$ )의 경우 그 전기적 성질이 산소분압과 온도의 영향에 따라 P형 반도체(p-type semiconductor)로 오래전부터 알려져 왔으며 중요한 전자재료(e. g. rectifier)로 사용되어 왔다. 그러나 산화제 II 동( $\text{CuO}$ )의 경우는  $\text{Cu}_2\text{O}$ 에 비해 뚜렷한 전기적 특성이 없으며, 또한 그 전기적 물성에 대한 연구가 상당히 적은 편이다. 이는  $\text{CuO}$ 가 산소분압과 온도에 상당히 민감하고, 그 결정구조가 tenorite<sup>2)</sup> 구조로써 NaCl형의 예외적인 독특한 구조를 하고 있으며, 철이금속산화물이 갖는 특이한 전기전도도 메카니즘과 시료의 처리과정에서 오는 불순물 영향등으로 전기적물성의 정확한 규명이 어려웠기 때문이 아닌가 한다. 일반적으로 철이금속산화물이 갖는 좁은 에너지금지대(narrow energy gap)로 인해, 'energy band theory'가 적용되지 못하며, 자기적성질(magnetic property)이 전기전도도에 미치는 영향등을 고려해야 하

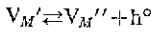
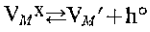
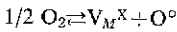
므로 사실 전기전도메카니즘의 규명이 복잡하게 된다<sup>2)</sup> 자기반도체(magnetic semiconductor) 측면에서 볼때 철이금속산화물의 전기전도도는 magnetic cation과 3d 에너지 준위를 통해 밀접한 관계를 갖고 자기적성질의 원인이 되는 전자상태와 연관을 갖는다.

그리고 d 밴드가 좁아서 'Bloch wilson's band theory'에서 무시한 전자사이의 정전기적 반발이 고려되어야 하는 동시에 전하운반자가 부근의 이온적자를 뒤흔리게 하면서 수반되는 분극에 의해 전자는 정전기적 'polaron'이라 불리는 quasi particle 로써 간주되어 전기전도도는 hopping 현상에 의해 일어난다는 이론이 지배적이다. 이와같은 이론은 3d 철이 금속산화물에서 일어나는 전기전도도를 설명하는 동시에 magnetic polaron의 개념을 유도해 주며, 실제로 최근에는 여러가지 hopping model이 제안되어 정확한 해석을 얻으려고 하고 있다. 그러나 산화제 II 동이 3d 철이금속산화물이면서 산소분압과 온도의 영향에 따라 비화학양론적화합물(nonstoichiometric compound)을 만들기 때문에 이로인해 결정내부에 원자결함<sup>3)</sup>이 생성되어 전

하운만자가 hole 에 의한 이온전도도를 보이고 있다. 즉 CuO 가 금속원자가 부족한 비화학양론적 조성을 갖는다.



또는



여기서

$O_i^x$ ; CuO 결정격자내부로 격자간 산소 원자 (interstitial oxygen atom)를 의미하며 첨자 i 와 x 는 각각 격자간 위치와 전기적증성을 의미한다.

$V_M^x$ ; 금속원자가 vacancy 로 존재하며 전기적으로 증성을 의미한다.

' ; negative effective charge

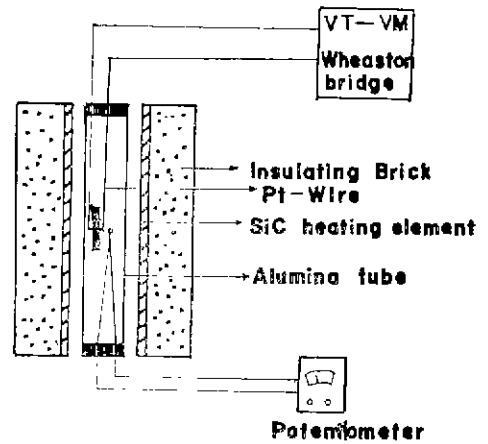
· ; positive effective charge

그러나 CuO 가 hole 전도도를 보이고 있지만 온도영향에 전기전도도가 intrinsic 한 성질을 보이고 있지 못하며 그 경로가 어떤 경로를 따르는가에 대해선 최근까지 정확한 설명이 있지 못하다. 따라서 본 실험은 CuO 의 전기전도도가 온도변화에 따라 변화하는 경로를 규명하고자 하는데 역점을 두어, 전기전도도와 온도와의 상관관계, 결정의 결함으로 인해 발생하는 결정격자의 변화를 조사하기 위해 X-ray 회절분석을 병행하였다. (X-ray 는 30kv, 15mA Ni filter, Cu target).

## 2. 실험방법

본 실험에서 사용된 시편은 Junsei chem. Co 의 CuO 분말(99.999%)을 사용하여 직경 13mm, 두께 2mm, 압력 200kg/cm<sup>2</sup>로 성형한후 소성하여 준비하였다. 소성은 성형된 시편을 백금접시 위에서 250°C/hr 의 승온속도로 900°C, 800°C, 700°C, 600°C, 500°C온도에서 1 시간씩 유지시킨후 자연냉각하였다. 소성된 시편은 1200 mesh SiC 연마지로 연마한후 250°C에서 4 시간 제가열하여 연마할때 표면에서 일어나는 공간전하영향과 스트레스(stress)를 줄였다. 이와같은 과정을 거친후 상온에서 Silver 전극을 부착해서 Yokokawa 제 Wheaton Bridge 를 사용하여 전기저항을 측정하였다.

또한 성형된 시편을 소성시키는 도중의 결정격자의 변화와 전기전도도와의 관계를 살피고져 20°C 간격으로 Yokokawa 제 107°C VT-VM ((0.01Ω까지 측정)으로 전기저항을 측정하였으며, 100°C 간격으로 X-ray 회절분석을 시행하였다. 그리고 CuO 의 전기전도도가



The measurement apparatus for the determination of the relation between temperature and electrical conductivity

온도변화에 따라 intrinsic 한가, extrinsic 한가를 살펴 보기 위해 다음과 같은 장치로 전기전도도와 온도와의 상관관계를 고찰 하였다.

## 3. 결과 및 고찰

각 온도에서 소성된 CuO 시편의 삼온 비저항값이 Fig. 1 에 나타나고 있다. CuO 로 표시된 값은 출발물질 을 Cu<sub>2</sub>O 하여 Cu<sub>2</sub>O→CuO 의 상전이를 거친후의 비저항값을 말한다. X-ray 회절분석을 한 결과 Cu<sub>2</sub>O 는 200 °C 에서 CuO 로 전이함 이 밝혀졌다. Fig. 1 에서 보여 주듯이 온도가 낮을수록 CuO 의 비저항값이 감소되고 있으며, 이와같은 현상은 CuO 의 비저항이 온도와 상관관계가 있음을 알려준다. 또한 편광현미경으로 시료 의 표면을 관찰하면 소결온도가 낮을수록 기공이 급증 하는 것이 나타나는데도 전기전도도가 증가하는 현상은 고온에서 일어나는 전기전도도와 저온에서 일어나 는 전기전도도가 복잡한 경로로 일어남을 암시해 주고 있으며 결함의 농도가 온도가 낮아짐에 따라 증가하고 있다는 모순을 보여준다. 왜냐하면 고온으로 갈수록 CuO 에 더 많은 결함이 일어나게 되는데, 실제 급냉 시켜보면 화학양론적 CuO 의 비저항과 거의 같은 값을 모인다. 이와같은 모순은 냉각이 미치는 영향을 고려 해 볼때, 냉각도중 상당량의 결함(defect)이 하나의 결 함으로 되면서, 다시말하면 defect reaction 이 일어나던 서 감소되기 때문이라 생각된다.

실제 P 형 반도체인 Cu<sub>2</sub>O 의 경우도 화학양론적 Cu<sub>2</sub>O

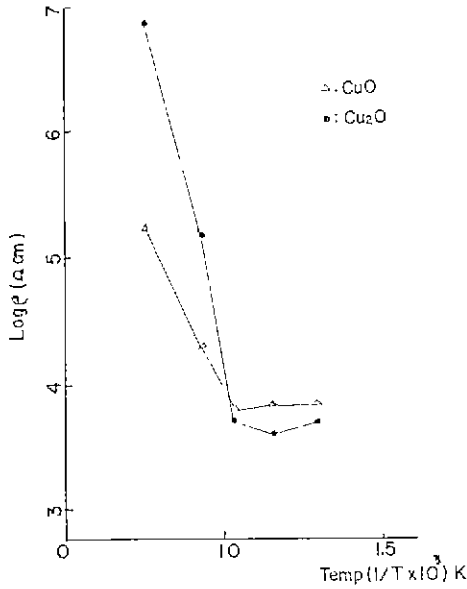


Fig. 1. Room temperature resistivity of  $\text{Cu}_2\text{O}$  and  $\text{CuO}$  with various sintering temperatures.

의 전기전도도와 고온에서 일어나는 비화학양론적  $\text{Cu}_2\text{O}_{1+x}$ 를 급냉시킨후의 전기전도도가 거의 같다는 모순을 보여 주고 있다<sup>3)</sup>. 또한  $\text{CuO}$ 를 급냉한 것이 서냉한후 전기전도도에 비해 낮다는 것이 밝혀졌다. Michale O'keeffe 에 의하면  $\text{CuO}$  단결정이 고온으로 갈수록 결함에 의한 positive hole pair 가 소멸되고 냉각도중 전자결합(electronic defect)이 복잡한 경로를 거친다고 보고 하였다. 이러한 현상을 간접적으로 조사하기 위해  $\text{CuO}$ 를 성형한후 소성시키는 도중의 전기전도도 변화를  $20^\circ\text{C}$  간격으로 5분간 유지한후 측정된 값을 Fig. 2에 도시하였다. 이때 전기전도도가  $200^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ 에서 급격하게 변화하는 현상을 볼수가 있는데 이는 대단히 중요한 의미를 갖는다. 온도가 증가 할수록 곡선의 기울기가 완만한 후,  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ 에서 다시 새로운 형태의 기울기를 보이고 있다. 이와같은 현상은 소성도중  $200^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ 에서  $\text{CuO}$ 의 전기전도도에 상당한 영향을 주는 요인이 있으며  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$  이상에서는 또다른 요인이 존재함을 암시해 준다.

K. Stecker<sup>4)</sup>에 의하면  $700^\circ\text{C} \sim 900^\circ\text{C}$ 에서  $\text{CuO}$ 의 전기전도도가 산소분압에 무관함을 제안하였고 이때 활성화에너지는, 25 kcal/mole 임을 밝혔다. 이와같은 제안을 달리 표현하면  $\text{CuO}$ 는  $700^\circ\text{C} \sim 900^\circ\text{C}$ 에서 전기전도도가 점결함(point defect)에 의해 intrinsic ionization이 일어남으로써 electron hole에 의한 전기전도도라

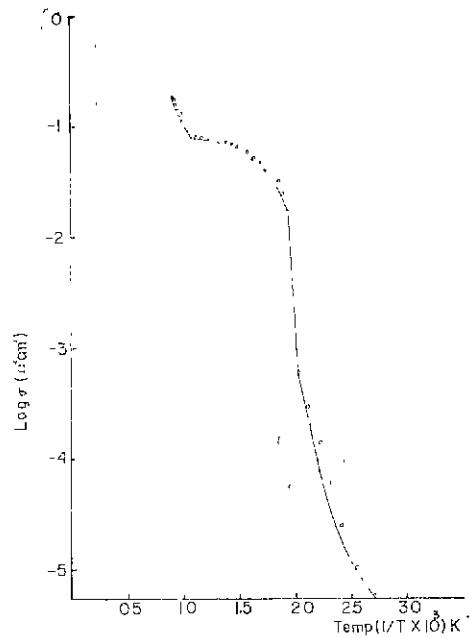


Fig. 2. Variation of the electrical conductivity of  $\text{CuO}$  during sintering in the stable region

할 수 있다. 이러한 제안은 본 실험에 있어  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$  이상에서 일어나는 곡선의 기울기의 의미를 설명하여 준다. Fig. 3는 각각의 온도별로 X-ray 회절분석한 결과이다.  $200^\circ\text{C}$ 에서  $\text{CuO}$ 의 결정격차가 변화하고 있고 즉, 결정격차의 d 값이 커지고 있다. 이와같은 사실을 Fig. 2에서 보여주는 전기전도도와 관련시켜보면 새로운 사실이 얻어진다.  $650^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$  이하에서 일어나는  $\text{CuO}$ 의 전기전도도는 비화학양론적 조성에 의한 것임을 알 수있고, 이때 일어나는 결함이 산소가 interstitial로 존재하는 결함이 될을 알 수있다. 이러한 현상이  $\text{CuO}$  결정구조에서 일어날 수 있는가를 살펴보기 위해 결정구조를 Fig. 4에 도시 하였다.  $\text{CuO}$ 의 구조에서 산소가 형성하는 팔면체 위치와 사면체 위치를보면 산소가 interstitial 할 수 있는 경우는 팔면체 공간뿐이다. 또한 Fig. 5는 Oxygen 1s photoelectron microscopy 인데 이때 531.6 eV의 Oxygen 1s peak는 강렬하게 흡착된 산소임을 보여주며 529.7 eV는  $\text{CuO}$ 의 결정격자에 위치한 산소에 기인된 것을 보여준다<sup>5)</sup>.  $\text{CuO}$  표면에 파잉의 산소가 존재함은 산소가  $\text{CuO}$ 의 결정 내부로 확산 될 수 있으며 확산경로가 interstitial mechanism으로 진행됨을 가정 할 수 있다. 왜냐하면 X-ray

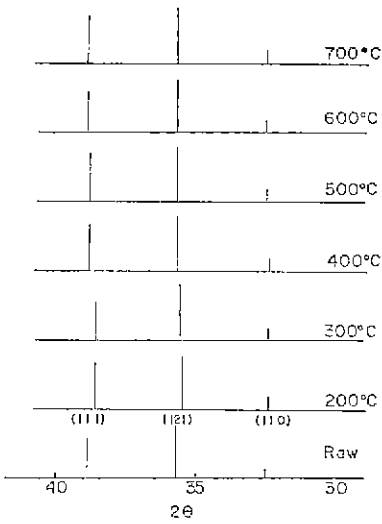


Fig. 3. X-ray diffraction patterns of CuO at various temperatures.

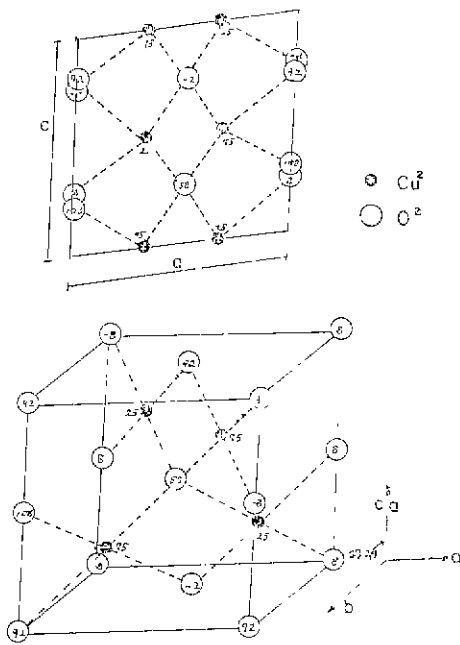


Fig. 4. STRUCTURE OF CuO.

회절분석에서 CuO의 결정격자가 커지고 있음은 산소 원자가 CuO의 결정내부로 확산한다고 할 수 있다. M. O'keeffe 등이 확산 측정할 결과 과잉의 산소가 CuO 결정내부에 interstitial로 존재한다고 하였다. Fig. 2와 Fig. 3에서 보여주는 전기전도도와 결정격자

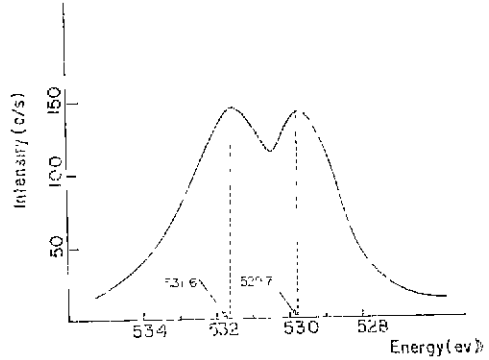


Fig. 5. Oxygen 1s photoelectron of CuO

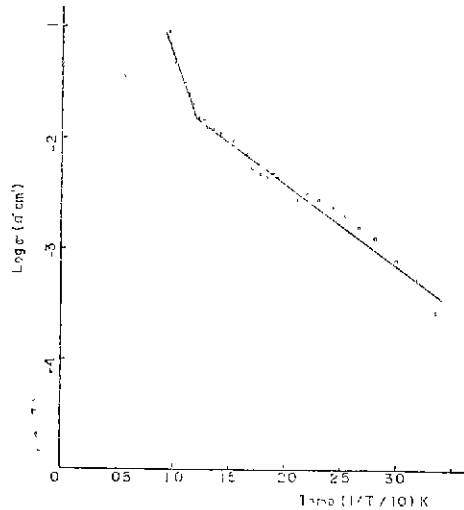


Fig. 6. Variation of the electrical conductivity of sintered CuO, at 800°C on temperature.

변화를 살펴보면 과잉의 산소가 온도가 올라감에 따라 감소하고 있으며 이때 전기전도도는 intrinsic한 모습을 보여주고 있다. 이와같은 이유는 아마 코어에 갇혀서 과잉의 산소가 potential barrier를 넘을수 있는 열 에너지를 받아 산소원자의 진동이 심해서 입계로 확산되거나 아니면 표면으로 확산되는 것이 아닌가 한다. 이에대한 명확한 해석은 산소분압을 측정하거나 입계에 존재하는 산소의 양을 측정해야 하는 조사가 더 필요하다. Fig. 6는 900°C에서 소성된 CuO 시편을 800°C까지 재가열시켜 온도변화와 전기전도도의 상관관계를 도사한 것인데 Fig. 2의 마찬가지로 650°C±10°C에서 직선의 기울기가 변화하고 있으며 이때 활성화에

너지는 아래부분이 0.15 eV, 650°C±10°C 이상에서는 1.04 eV 이다. 이와같은 값중에서 650°C±10°C 이상의 활성화에너지는 K. Stecker 가 밝힌 25 kcal/mole 과 거의 일치하고 있다.

#### 4. 결 론

이상과 같이 본 실험에서 얻은 내용을 바탕으로 CuO 의 온도변화에 따른 전기 전도 메카니즘은 다음과 같이 요약 될 수 있다.

1. CuO 는 650°C±10°C 이하에서는 CuO 에 의한 hole 전도를 보이고 있으며 650°C±10°C 이상에서는 화학양론적 CuO 에 의한 electron-hole 전도를 보이고 있다. 이때 각각의 활성화 에너지는 0.15 eV, 1.04 eV 이다.
2. CuO 결정에서 일어나는 결합은 산소가 CuO 의 결정내부의 팔면체 공간에 interstitial 하는 결합이 지배적이다.
3. 650°C±10°C 이상에서는  $O_0 \rightleftharpoons e'$  or  $h^\circ$  이며 650°C ±10°C 이하에서는  $CuO + 1/2O_2 \rightleftharpoons CuO + O_i'' + 2h$

#### 참 고 문 헌

1. Crystal structure of minerals Conell Univ. Press (1965) page 94-96
2. Magnetic semiconductor. *Contemp. Phys* **11** (5) 445-476 (1970)
3. The magnetochemistry and stoichiometry of the copper-Oxygen System, M. O. 'keeffe, F. S. stone. Dept. of phys and Inorganic chem. Univ. of Bristol.
4. Characterization of oxygen species absorbed on copper and nickel oxide by X-ray photoelectron spectroscopy. T. Robert, M. Bartel G. Offergeld. *surface sci* 33(1) x23-30 (1972).
5. The defect structure of CuO. M. O'keeffe. Yukiko Ebisuzaki. Walter J. Moore, *J. Phys. Soc. Japan* **18**. Supply 2 13x-6 (1963).
6. The semiconducting, Property of cuprous oxide K. Stecker, *Ann Physik* **7** 55, (1959) **7** 70, (1959)
7. Nonstoichiometry diffusion and electrical conductivity in binary metal oxide. Per Kofstad. General Institute for Industrial Research Blindem Oslo. Norway (1972)
8. Band structure and the sakeup photoelectron spectra of copper and nickel hallide and oxide. T. Novakov, R. Prins, *Solid state comm*, Vol. **9**, page 1975-1979 (1971)